









CD54AC74, CD74AC74

JAJSV60E - NOVEMBER 1998 - REVISED AUGUST 2024

CDx4AC74 デュアル ポジティブ エッジ トリガ D タイプ フリップ フロップ、 クリア/プリセット搭載

1 特長

- AC タイプは 1.5V~5.5V で動作、電源の 30% での 平衡ノイズ耐性
- バイポーラF、AS、Sの速度と消費電力の大幅な低減
- 伝搬遅延時間の平衡化
- ±24mA の出力駆動電流:15 個の F デバイスへのファ ンアウト
- SCR ラッチアップ耐性の高い CMOS プロセスと回路 設計

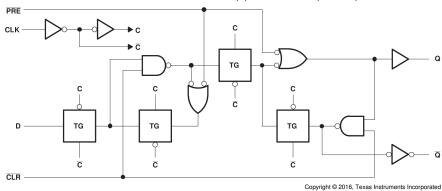
2 概要

AC74 デュアル ポジティブ エッジ トリガ デバイスは、Dタ イプ フリップ フロップです。

製品情報

部品番号	パッケージ ⁽¹⁾	パッケージ サイズ ⁽²⁾	本体サイズ ⁽³⁾
	J (CDIP, 14)	19.56mm × 7.9mm	19.56mm × 6.67mm
CDx4AC74	N (PDIP、14)	19.3mm × 9.4mm	19.3mm × 6.35mm
	D (SOIC, 14)	8.65mm × 6mm	8.65mm × 3.9mm

- 詳細については、セクション 10 を参照してください。 (1)
- (2) パッケージ サイズ (長さ×幅) は公称値であり、該当する場合はピ ンも含まれます。
- (3)本体サイズ (長さ×幅) は公称値であり、ピンは含まれません。



論理図、各フリップ フロップ (正論理)



Table of Contents

1 特長1	6 De
2 概要1	6.
3 Pin Configuration and Functions3	6.
4 Specifications4	6.
4.1 Absolute Maximum Ratings4	7 Ap
4.2 ESD Ratings4	7.
4.3 Recommended Operating Conditions4	8 De
4.4 Thermal Information5	8.
4.5 Electrical Characteristics5	8.
4.6 Timing Requirements, V _{CC} = 1.5 V5	8.
4.7 Timing Requirements, V _{CC} = 3.3 V ± 0.3 V6	8.
4.8 Timing Requirements, V _{CC} = 5 V ± 0.5 V6	8.
4.9 Switching Characteristics, V _{CC} = 1.5 V6	8.
4.10 Switching Characteristics, V _{CC} = 3.3 V ± 0.3 V6	9 Re
4.11 Switching Characteristics, V _{CC} = 5 V ± 0.5 V7	10 N
4.12 Operating Characteristics7	In
5 Parameter Measurement Information 8	

6 Detailed Description	
6.1 Overview	10
6.2 Functional Block Diagram	
6.3 Device Functional Modes	10
7 Application and Implementation	11
7.1 Layout	
8 Device and Documentation Support	
8.1 Documentation Support (Analog)	12
8.2ドキュメントの更新通知を受け取る方法	12
8.3 サポート・リソース	12
8.4 Trademarks	12
8.5 静電気放電に関する注意事項	12
8.6 用語集	12
9 Revision History	12
10 Mechanical, Packaging, and Orderable	
Information	13



3 Pin Configuration and Functions

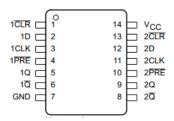


図 3-1. CD54AC74 F Package, 14-Pin CDIP; CD74AC74 E or M Package, 14-Pin PDIP or SOIC (Top View)

Pin Functions

PIN		1/0	DESCRIPTION		
NAME	NO.	- 1/O	DESCRIPTION		
1 CLR	1	Input	Channel 1, Clear Input, Active Low		
1D	2	Input	Channel 1, Data Input		
1CLK	3	Input	Channel 1, Positive edge triggered clock input		
1 PRE	4	Input	Channel 1, Preset Input, Active Low		
1Q	5	Output	Channel 1, Output		
1 Q	6	Output	Channel 1, Inverted Output		
GND	7	_	Ground		
2 Q	8	Output	Channel 2, Inverted Output		
2Q	9	Output	Channel 2, Output		
2 PRE	10	Input	Channel 2, Preset Input, Active Low		
2CLK	11	Input	Channel 2, Positive edge triggered clock input		
2D	12	Input	Channel 2, Data Input		
2 CLR	13	Input	Channel 2, Clear Input, Active Low		
V _{CC}	14		Positive Supply		



4 Specifications

4.1 Absolute Maximum Ratings

over operating free-air temperature range (unless otherwise noted) (1)

			MIN	MAX	UNIT
V _{CC}	Supply voltage range		-0.5	6	V
I _{IK} 1	Input clamp current	$(V_1 < 0 \text{ or } V_1 > V_{CC})$		±20	mA
I _{OK} 1	Output clamp current	$(V_O < 0 \text{ or } V_O > V_{CC})$		±50	mA
Io	Continuous output current	$(V_O = 0 \text{ to } V_{CC})$		±50	mA
	Continuous current through V	Continuous current through V _{CC} or GND		±100	mA
T _{stg}	Storage temperature range		-65	150	°C

⁽¹⁾ Stresses beyond those listed under "absolute maximum ratings" may cause permanent damage to the device. These are stress ratings only, and functional operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated under "recommended operating conditions" is not implied. Exposure to absolute-maximum-rated conditions for extended periods may affect device reliability.

4.2 ESD Ratings

			VALUE	UNIT
$V_{(ESD)}$	Electrostatic discharge	Human-body model (HBM), per ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 ⁽¹⁾	±2000	V

⁽¹⁾ JEDEC document JEP155 states that 500-V HBM allows safe manufacturing with a standard ESD control process.

4.3 Recommended Operating Conditions

over operating free-air temperature range (unless otherwise noted)(1)

			T _A = 2	5°C	−55°C 125°		-40°C to 85°C		UNIT
			MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	
V _{CC}	Supply voltage		1.5	5.5	1.5	5.5	1.5	5.5	V
		V _{CC} = 1.5 V	1.2		1.2		1.2		
V _{IH}	High-level input voltage	V _{CC} = 3 V	2.1		2.1		2.1		V
		V _{CC} = 5.5 V	3.85		3.85		3.85		
		V _{CC} = 1.5 V		0.3		0.3		0.3	
V _{IL}	Low-level input voltage	V _{CC} = 3 V		0.9		0.9		0.9	V
		V _{CC} = 5.5 V		1.65		1.65		1.65	
VI	Input voltage	, ,	0	V_{CC}	0	V _{CC}	0	V _{CC}	V
Vo	Output voltage		0	V_{CC}	0	V _{CC}	0	V _{CC}	V
I _{OH}	High-level output current	V _{CC} = 4.5 V to 5.5 V		- 24		-24		-24	mA
I _{OL}	Low-level output current	V _{CC} = 4.5 V to 5.5 V		24		24		24	mA
Δt/Δν	Input transition rise or fall rate	V _{CC} = 1.5 V to 3 V		50		50		50	ns/V
ΔυΔν	Input transition rise or fall rate	V _{CC} = 3.6 V to 5.5 V		20		20		20	115/V

⁽¹⁾ All unused inputs of the device must be held at V_{CC} or GND to ensure proper device operation. Refer to the TI application report, Implications of Slow or Floating CMOS Inputs, literature number SCBA004.

資料に関するフィードバック(ご意見やお問い合わせ)を送信

Copyright © 2024 Texas Instruments Incorporated

²⁾ The input and output voltage ratings may be exceeded if the input and output current ratings are observed.

4.4 Thermal Information

		CDx4	AC74	
	THERMAL METRIC ⁽¹⁾	N (PDIP)	D (SOIC)	UNIT
		14 PINS	14 PINS	
$R_{\theta JA}$	Junction-to-ambient thermal resistance	80	119.9	°C/W

⁽¹⁾ For more information about traditional and new thermal metrics, see the Semiconductor and IC Package Thermal Metrics application report.

4.5 Electrical Characteristics

over recommended operating free-air temperature range (unless otherwise noted)

PARAMETER	TEST CONDITIONS		V _{CC}	T _A = 25°C	−55°C to 125°C	-40°C to 85°C	UNIT
			MIN MAX	MIN MAX	MIN MAX		
			1.5 V	1.4	1.4	1.4	
V _{OH}		I _{OH} = -50 μA	3 V	2.9	2.9	2.9	
			4.5 V	4.4	4.4	4.4	
	$V_I = V_{IH}$ or V_{IL}	I _{OH} = -4 mA	3 V	2.58	2.4	2.48	V
		I _{OH} = - 24 mA	4.5 V	3.94	3.7	3.8	
		$I_{OH} = -50 \text{ mA}^{(1)}$	5.5 V		3.85		
		$I_{OH} = -75 \text{ mA}^{(1)}$	5.5 V			3.85	
			1.5 V	0.1	0.1	0.1	
		I _{OL} = 50 μA	3 V	0.1	0.1	0.1	
			4.5 V	0.1	0.1	0.1	
V _{OL}	$V_I = V_{IH}$ or V_{IL}	I _{OL} = 12 mA	3 V	0.36	0.5	0.44	V
		I _{OL} = 24 mA	4.5 V	0.36	0.5	0.44	
		I _{OL} = 50 mA ⁽¹⁾	5.5 V		1.65		
		I _{OL} = 75 mA ⁽¹⁾	5.5 V			1.65	
I _I	V _I = V _{CC} or GND		5.5 V	±0.1	±1	±1	μΑ
Icc	$V_I = V_{CC}$ or GND,	I _O = 0	5.5 V	4	80	40	μA
Ci				10	10	10	pF

⁽¹⁾ Test one output at a time, not exceeding 1-second duration. Measurement is made by forcing indicated current and measuring voltage to minimize power dissipation. Test verifies a minimum 50-Ω transmission-line drive capability at 85°C and 75-Ω transmission-line drive capability at 125°C.

4.6 Timing Requirements, V_{CC} = 1.5 V

over recommended operating free-air temperature range, V_{CC} = 1.5 V (unless otherwise noted)

					°C to 5°C	-40°C to 85°C		UNIT
				MI N	MAX	MIN	MAX	UNII
f _{clock}	Clock frequency				9		10	MHz
t., Pulse duration		PRE or CLR low	50		44		no	
t _w	ruise duration	AUOH	CLK	56		49		ns
	Satura time		Data	44		39		ns
t _{su}	Setup time	PRE or CLR inactive					ns	
t _h	Hold time		Data after CLK ↑	0		0		ns
t _{rec}	Recovery time, before CLK ↑		CLR ↑ or PRE ↑	34		30		ns

資料に関するフィードバック(ご意見やお問い合わせ)を送信

5



4.7 Timing Requirements, V_{CC} = 3.3 V ± 0.3 V

over recommended operating free-air temperature range, V_{CC} = 3.3 V ± 0.3 V (unless otherwise noted) (see Load Circuit and Voltage Waveforms)

			−55°C to 125°C		-40°C to 85°C		UNIT
			MIN	MAX	MIN	MAX	
f _{clock}	Clock frequency			79		90	MHz
	Pulse duration	PRE or CLR low	5.6		4.9		ns
t _w		CLK	6.3		5.5		
	Cotup time	Data	4.9		4.3		ns
t _{su}	Setup time	PRE or CLR inactive					ns
t _h	Hold time	Data after CLK ↑	0		0		ns
t _{rec}	Recovery time, before CLK ↑	CLR ↑ or PRE ↑	4.7		4.1		ns

4.8 Timing Requirements, V_{CC} = 5 V ± 0.5 V

over recommended operating free-air temperature range, V_{CC} = 5 V ± 0.5 V (unless otherwise noted) (see Load Circuit and Voltage Waveforms)

	·		−55°C to 125°C		-40°C to 85°C		UNIT
			MIN	MAX	MIN	MAX	
f _{clock}	Clock frequency			110		125	MHz
	Pulse duration	PRE or CLR low	4		3.5		ne
t _w		CLK	4.5		3.9		ns
	Catua tima	Data	3.5		3.1		ns
t _{su}	Setup time	PRE or CLR inactive					ns
t _h	Hold time	Data after CLK ↑	0		0		ns
t _{rec}	Recovery time, before CLK ↑	CLR ↑ or PRE ↑	2.7		2.4		ns

4.9 Switching Characteristics, V_{CC} = 1.5 V

over recommended operating free-air temperature range, V_{CC} = 1.5 V, C_L = 50 pF (unless otherwise noted) (see Load Circuit and Voltage Waveforms)

PARAMETER	FROM (INPUT)	то (оитрит)	−55°C 125°		-40°C to 85°C		UNIT
			MIN	MAX	MIN	MAX	
f _{max}			9		10		MHz
t _{PLH}	- CLK	Q or Q		125		114	no
t _{PHL}	CLK			125		114	ns
t _{PLH}	PRE or CLR	Q or Q		132		120	ns
t _{PHL}	- FILE OF OLIX	الم الم		144		131	115

4.10 Switching Characteristics, V_{CC} = 3.3 V ± 0.3 V

over recommended operating free-air temperature range, V_{CC} = 3.3 V \pm 0.3 V (unless otherwise noted) (see Load Circuit and Voltage Waveforms)

PARAMETER	EDOM (INDUT)	TO (OUTPUT)	−55°C to 125°C	-40°C to 85°C	UNIT
	FROM (INPUT)	10 (001701)	MIN MAX	MIN MA	
f _{max}			79	90	MHz



over recommended operating free-air temperature range, V_{CC} = 3.3 V \pm 0.3 V (unless otherwise noted) (see Load Circuit and Voltage Waveforms)

PARAMETER	FROM (INPUT)	TO (OUTPUT)	−55°C 125°		−40°C to	UNIT	
TANAMETER	TROM (NY 01)	10 (0017-01)	MIN	MAX	MIN	MA X	
t _{PLH}	CLK	Q or Q	3.5	14	3.6	12.7	ns
t _{PHL}	GLIX	QUIQ	3.5	14	3.6	12.7	
t _{PLH}	PRE or CLR	Q or Q	3.7	14.7	3.8	13.4	ns
t _{PHL}	FIXE OF GER	Q OI Q	4	16.1	4.1	14.6	115

4.11 Switching Characteristics, $V_{CC} = 5 V \pm 0.5 V$

over recommended operating free-air temperature range, V_{CC} = 5 V ± 0.5 V (unless otherwise noted) (see Load Circuit and Voltage Waveforms)

PARAMETER	EDOM (INDUT)	TO (OUTPUT)	−55°C 125°		-40°C to	UNIT	
TANAMETER	FROM (INPUT)	10 (0017-01)	MIN	MAX	MIN	MA X	J
f _{max}			110		125		MHz
t _{PLH}	CLK	Q or Q	2.5	10	2.6	9.1	ns
t _{PHL}	GER	QolQ	2.5	10	2.6	9.1	115
t _{PLH}	PRE or CLR	Q or $\overline{\mathbb{Q}}$	2.6	10.5	2.7	9.5	ns
t _{PHL}	FILE OF CER	Q OI Q	2.9	11.5	3	10.4	115

4.12 Operating Characteristics

 $T_A = 25^{\circ}C$

	PARAMETER					
C _{pd}	Power dissipation capacitance	55	pF			



5 Parameter Measurement Information

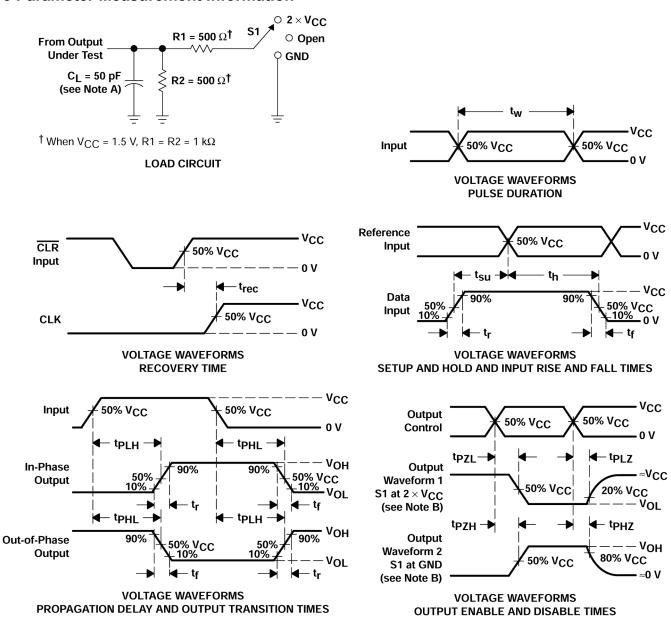


図 5-1. Load Circuit and Voltage Waveforms



www.ti.com/ja-jp

- A. C_L includes probe and test-fixture capacitance.
- B. Waveform 1 is for an output with internal conditions such that the output is low except when disabled by the output control. Waveform 2 is for an output with internal conditions such that the output is high except when disabled by the output control.
- C. All input pulses are supplied by generators having the following characteristics: PRR \leq 1 MHz, $Z_0 = 50 \Omega$, $t_r = 3 \text{ ns. } t_f = 3 \text{ ns. Phase}$ relationships between waveforms are arbitrary.
- D. For clock inputs, f_{max} is measured with the input duty cycle at 50%.
- E. The outputs are measured one at a time with one input transition per measurement.
- t_{PLH} and t_{PHL} are the same as t_{pd}.
- G. t_{PZL} and t_{PZH} are the same as t_{en}.
- H. t_{PLZ} and t_{PHZ} are the same as t_{dis} .

TEST	S1
t _{PLH} /t _{PHL}	Open
t _{PLZ} /t _{PZL}	2 × V _{CC}
t _{PHZ} /t _{PZH}	GND

English Data Sheet: SCHS231

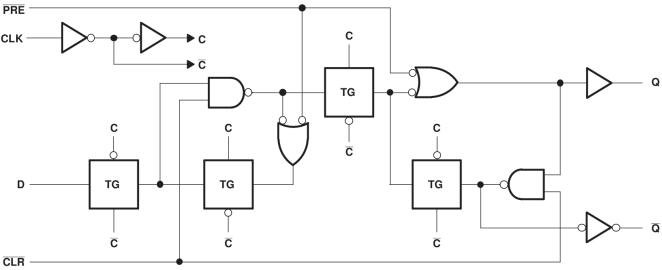
6 Detailed Description

6.1 Overview

The 'AC74 dual positive-edge-triggered devices are D-type flip-flops.

A low level at the preset (PRE) or clear (CLR) inputs sets or resets the outputs, regardless of the levels of the other inputs. When PRE and CLR are inactive (high), data at the data (D) input meeting the setup time requirements is transferred to the outputs on the positive-going edge of the clock pulse. Clock triggering occurs at a voltage level and is not related directly to the rise time of the clock pulse. Following the hold-time interval, data at the D input can be changed without affecting the levels at the outputs.

6.2 Functional Block Diagram



Copyright © 2016, Texas Instruments Incorporated

図 6-1.

6.3 Device Functional Modes

表 6-1. Function Table (Each Flip-flop)

		OUTPUTS			
PRE	CLR	CLK	D	Q	Q
L	Н	Х	Х	Н	L
Н	L	Х	Х	L	Н
L	L	Х	Х	H ⁽¹⁾	H (1)
Н	Н	1	Н	Н	L
Н	Н	1	L	L	Н
Н	Н	L	Х	Q_0	\overline{Q}_0

This configuration is nonstable; that is, it does not persist when PRE or CLR returns to its inactive (high) level.

English Data Sheet: SCHS231



7 Application and Implementation

注

以下のアプリケーション情報は、テキサス・インスツルメンツの製品仕様に含まれるものではなく、テキサス・インスツルメンツはその正確性も完全性も保証いたしません。個々の目的に対する製品の適合性については、お客様の責任で判断していただくことになります。また、お客様は自身の設計実装を検証しテストすることで、システムの機能を確認する必要があります。

Power Supply Recommendations

The power supply may be any voltage between the minimum and maximum supply voltage rating located in セクション 4.3

Each V_{CC} terminal must have a good bypass capacitor to prevent power disturbance. A 0.1- μ F capacitor is recommended for devices with a single supply. If there are multiple V_{CC} terminals, then 0.01- μ F or 0.022- μ F capacitors are recommended for each power terminal. It is permissible to parallel multiple bypass capacitors to reject different frequencies of noise. Multiple bypass capacitors may be paralleled to reject different frequencies of noise. The bypass capacitor must be installed as close to the power terminal as possible for the best results.

7.1 Layout

7.1.1 Layout Guidelines

Inputs must not float when using multiple bit logic devices. In many cases, functions or parts of functions of digital logic devices are unused. Some examples include situations when only two inputs of a triple-input AND gate are used, or when only 3 of the 4-buffer gates are used. Such input pins must not be left unconnected because the undefined voltages at the outside connections result in undefined operational states.

Specified in Layout Example for the CD74AC74 are rules that must be observed under all circumstances. All unused inputs of digital logic devices must be connected to a high or low bias to prevent them from floating. The logic level that must be applied to any particular unused input depends on the function of the device. Generally, they are tied to GND or V_{CC}, whichever makes more sense or is more convenient.

7.1.2 Layout Example

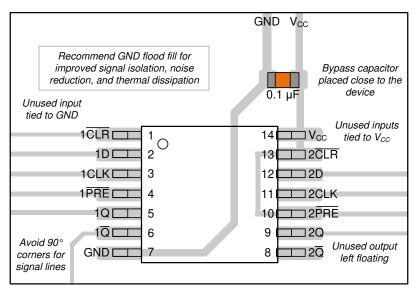


図 7-1. Example layout for the CD74AC74

8 Device and Documentation Support

TI offers an extensive line of development tools. Tools and software to evaluate the performance of the device, generate code, and develop solutions are listed below.

8.1 Documentation Support (Analog)

8.1.1 Related Documentation

The table below lists quick access links. Categories include technical documents, support and community resources, tools and software, and quick access to sample or buy.

表 8-1. Related Links

PARTS	PRODUCT FOLDER	SAMPLE & BUY	TECHNICAL DOCUMENTS	TOOLS & SOFTWARE	SUPPORT & COMMUNITY	
CD54AC74	Click here	Click here	Click here	Click here	Click here	
CD74AC74	Click here	Click here	Click here	Click here	Click here	

8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法

ドキュメントの更新についての通知を受け取るには、www.tij.co.jp のデバイス製品フォルダを開いてください。[通知] をクリックして登録すると、変更されたすべての製品情報に関するダイジェストを毎週受け取ることができます。 変更の詳細については、改訂されたドキュメントに含まれている改訂履歴をご覧ください。

8.3 サポート・リソース

テキサス・インスツルメンツ E2E™ サポート・フォーラムは、エンジニアが検証済みの回答と設計に関するヒントをエキスパートから迅速かつ直接得ることができる場所です。既存の回答を検索したり、独自の質問をしたりすることで、設計で必要な支援を迅速に得ることができます。

リンクされているコンテンツは、各寄稿者により「現状のまま」提供されるものです。これらはテキサス・インスツルメンツの仕様を構成するものではなく、必ずしもテキサス・インスツルメンツの見解を反映したものではありません。テキサス・インスツルメンツの使用条件を参照してください。

8.4 Trademarks

テキサス・インスツルメンツ E2E™ is a trademark of Texas Instruments.

すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

8.5 静電気放電に関する注意事項



この IC は、ESD によって破損する可能性があります。テキサス・インスツルメンツは、IC を取り扱う際には常に適切な注意を払うことを推奨します。正しい取り扱いおよび設置手順に従わない場合、デバイスを破損するおそれがあります。

ESD による破損は、わずかな性能低下からデバイスの完全な故障まで多岐にわたります。精密な IC の場合、パラメータがわずかに変化するだけで公表されている仕様から外れる可能性があるため、破損が発生しやすくなっています。

8.6 用語集

テキサス・インスツルメンツ用語集 この用語集には、用語や略語の一覧および定義が記載されています。

9 Revision History

資料番号末尾の英字は改訂を表しています。その改訂履歴は英語版に準じています。

Changes from Revision D (December 2002) to Revision E (August 2024)

Page

資料に関するフィードバック(ご意見やお問い合わせ)を送信

Copyright © 2024 Texas Instruments Incorporated

English Data Sheet: SCHS231



• Updated RθJA values: D = 86 to 119.9, all values in °C/W......5

10 Mechanical, Packaging, and Orderable Information

The following pages include mechanical, packaging, and orderable information. This information is the most current data available for the designated devices. This data is subject to change without notice and revision of this document. For browser-based versions of this data sheet, refer to the left-hand navigation.

Copyright © 2024 Texas Instruments Incorporated

資料に関するフィードバック(ご意見やお問い合わせ)を送信

13

重要なお知らせと免責事項

テキサス・インスツルメンツは、技術データと信頼性データ (データシートを含みます)、設計リソース (リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、テキサス・インスツルメンツ製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した テキサス・インスツルメンツ製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとします。

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されているテキサス・インスツルメンツ製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、テキサス・インスツルメンツはその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。テキサス・インスツルメンツや第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、テキサス・インスツルメンツおよびその代理人を完全に補償するものとし、テキサス・インスツルメンツは一切の責任を拒否します。

テキサス・インスツルメンツの製品は、テキサス・インスツルメンツの販売条件、または ti.com やかかる テキサス・インスツルメンツ製品の関連資料などのいずれかを通じて提供する適用可能な条項の下で提供されています。テキサス・インスツルメンツがこれらのリソースを提供することは、適用されるテキサス・インスツルメンツの保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案した場合でも、テキサス・インスツルメンツはそれらに異議を唱え、拒否します。

郵送先住所: Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265 Copyright © 2024, Texas Instruments Incorporated www.ti.com 2-Aug-2024

PACKAGING INFORMATION

Orderable Device	Status (1)	Package Type	Package Drawing	Pins	Package Qty	Eco Plan	Lead finish/ Ball material	MSL Peak Temp	Op Temp (°C)	Device Marking (4/5)	Samples
CD54AC74F3A	ACTIVE	CDIP	J	14	25	Non-RoHS & Green	SNPB	N / A for Pkg Type	-55 to 125	CD54AC74F3A	Samples
CD74AC74E	ACTIVE	PDIP	N	14	25	RoHS & Green	NIPDAU	N / A for Pkg Type	-55 to 125	CD74AC74E	Samples
CD74AC74M	OBSOLETE	SOIC	D	14		TBD	Call TI	Call TI	-55 to 125	AC74M	
CD74AC74M96	ACTIVE	SOIC	D	14	2500	RoHS & Green	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-55 to 125	AC74M	Samples

⁽¹⁾ The marketing status values are defined as follows:

ACTIVE: Product device recommended for new designs.

LIFEBUY: TI has announced that the device will be discontinued, and a lifetime-buy period is in effect.

NRND: Not recommended for new designs. Device is in production to support existing customers, but TI does not recommend using this part in a new design.

PREVIEW: Device has been announced but is not in production. Samples may or may not be available.

OBSOLETE: TI has discontinued the production of the device.

(2) RoHS: TI defines "RoHS" to mean semiconductor products that are compliant with the current EU RoHS requirements for all 10 RoHS substances, including the requirement that RoHS substance do not exceed 0.1% by weight in homogeneous materials. Where designed to be soldered at high temperatures, "RoHS" products are suitable for use in specified lead-free processes. TI may reference these types of products as "Pb-Free".

RoHS Exempt: TI defines "RoHS Exempt" to mean products that contain lead but are compliant with EU RoHS pursuant to a specific EU RoHS exemption.

Green: TI defines "Green" to mean the content of Chlorine (CI) and Bromine (Br) based flame retardants meet JS709B low halogen requirements of <=1000ppm threshold. Antimony trioxide based flame retardants must also meet the <=1000ppm threshold requirement.

- (3) MSL, Peak Temp. The Moisture Sensitivity Level rating according to the JEDEC industry standard classifications, and peak solder temperature.
- (4) There may be additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category on the device.
- (5) Multiple Device Markings will be inside parentheses. Only one Device Marking contained in parentheses and separated by a "~" will appear on a device. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire Device Marking for that device.
- (6) Lead finish/Ball material Orderable Devices may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

Important Information and Disclaimer: The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and

PACKAGE OPTION ADDENDUM

www.ti.com 2-Aug-2024

continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

OTHER QUALIFIED VERSIONS OF CD54AC74, CD74AC74:

Catalog : CD74AC74

Military: CD54AC74

NOTE: Qualified Version Definitions:

• Catalog - TI's standard catalog product

• Military - QML certified for Military and Defense Applications

PACKAGE MATERIALS INFORMATION

www.ti.com 15-Oct-2024

TAPE AND REEL INFORMATION





A0	Dimension designed to accommodate the component width
В0	Dimension designed to accommodate the component length
K0	Dimension designed to accommodate the component thickness
W	Overall width of the carrier tape
P1	Pitch between successive cavity centers

QUADRANT ASSIGNMENTS FOR PIN 1 ORIENTATION IN TAPE



*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing		SPQ	Reel Diameter (mm)	Reel Width W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 Quadrant
CD74AC74M96	SOIC	D	14	2500	330.0	16.4	6.5	9.0	2.1	8.0	16.0	Q1
CD74AC74M96	SOIC	D	14	2500	330.0	16.4	6.5	9.0	2.1	8.0	16.0	Q1

www.ti.com 15-Oct-2024



*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)
CD74AC74M96	SOIC	D	14	2500	356.0	356.0	35.0
CD74AC74M96	SOIC	D	14	2500	353.0	353.0	32.0

PACKAGE MATERIALS INFORMATION

www.ti.com 15-Oct-2024

TUBE



*All dimensions are nominal

Device	Package Name	Package Type	Pins	SPQ	L (mm)	W (mm)	T (µm)	B (mm)
CD74AC74E	N	PDIP	14	25	506	13.97	11230	4.32
CD74AC74E	N	PDIP	14	25	506	13.97	11230	4.32



SMALL OUTLINE INTEGRATED CIRCUIT



NOTES:

- 1. All linear dimensions are in millimeters. Dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.

 2. This drawing is subject to change without notice.

 3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not
- exceed 0.15 mm, per side.
- 4. This dimension does not include interlead flash. Interlead flash shall not exceed 0.43 mm, per side.
- 5. Reference JEDEC registration MS-012, variation AB.



SMALL OUTLINE INTEGRATED CIRCUIT



NOTES: (continued)

6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.

7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.



SMALL OUTLINE INTEGRATED CIRCUIT



NOTES: (continued)

- 8. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
- 9. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.



CERAMIC DUAL IN LINE PACKAGE



Images above are just a representation of the package family, actual package may vary. Refer to the product data sheet for package details.

4040083-5/G





CERAMIC DUAL IN LINE PACKAGE



NOTES:

- 1. All controlling linear dimensions are in inches. Dimensions in brackets are in millimeters. Any dimension in brackets or parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
- 2. This drawing is subject to change without notice.
- 3. This package is hermitically sealed with a ceramic lid using glass frit.
- His package is remitted by sealed with a ceramic its using glass mit.
 Index point is provided on cap for terminal identification only and on press ceramic glass frit seal only.
 Falls within MIL-STD-1835 and GDIP1-T14.



CERAMIC DUAL IN LINE PACKAGE



N (R-PDIP-T**)

PLASTIC DUAL-IN-LINE PACKAGE

16 PINS SHOWN



NOTES:

- A. All linear dimensions are in inches (millimeters).
- B. This drawing is subject to change without notice.
- Falls within JEDEC MS-001, except 18 and 20 pin minimum body length (Dim A).
- The 20 pin end lead shoulder width is a vendor option, either half or full width.



重要なお知らせと免責事項

TI は、技術データと信頼性データ (データシートを含みます)、設計リソース (リファレンス・デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、TI 製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した TI 製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあら ゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとします。

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている TI 製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、TI はその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。TI や第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、TI およびその代理人を完全に補償するものとし、TI は一切の責任を拒否します。

TIの製品は、TIの販売条件、または ti.com やかかる TI 製品の関連資料などのいずれかを通じて提供する適用可能な条項の下で提供されています。TI がこれらのリソースを提供することは、適用される TI の保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案した場合でも、TIはそれらに異議を唱え、拒否します。

郵送先住所: Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265 Copyright © 2024, Texas Instruments Incorporated